BSM360 快捷操作说明

一. 键盘简介



仪器的操作都是由面板按键直接触发或者几个按键组合出发实现的,下表给出了操作面 板按键的具体图示和按键名称、功能。

图示	名称	功能说明				
F1	Fn 键	按对应的 Fn 键,可以选择屏幕底部列出的相应的功能组,选 择相应的功能组同时,该功能组内的所有功能项将在屏幕右 边显示出来。				
	方向键	左、右键用于调节参数,上、下键用于调整功能组中功能项 的选择。				
-	确认键	在有复用功能的功能选项上按确认键可以切换复用功能,在 具备粗细两种调节方式的功能项上按确认键可以切换功能项 的粗调或细调方式。				
dB+	增益+	按增益+键,增益就会以设定的增益步长增加,增益调整范围 是 0dB~110dB。				
dB-	增益-	按增益-键,增益就会以设定的增益步长减小,增益调整范围 是 0dB~110dB。				
ANB	增益步长	按增益步长键,增益步长会在12.0dB、6.0dB、2.0dB、1.0dB、0.5dB、0.2dB、0dB 七挡内循环变化,选择合适的增益步长,可以快速地将增益调整到需要的数值。				
	冻结键	在工作过程中,按冻结键可以将当时屏幕上显示的波形以及 数据冻结,再次按下可以解冻。				

	探测范围	按探测范围键,屏幕可以快速切换到探测范围功能菜单,可 快速对对探测范围进行调整。
	闸门 A	按闸门A键,屏幕可以快速切换到闸门A功能菜单,连线按 此键可使功能菜单在A闸门起始、A闸门宽度、A闸门高度 三个功能间切换,可快速对相应功能进行调整。
В	闸门 B	按闸门 B 键,屏幕可以快速切换到闸门 B 功能菜单,连线按 此键可使功能菜单在 B 闸门起始、B 闸门宽度、B 闸门高度 三个功能间切换,可快速对相应功能进行调整。
	翻页键	全部功能组分布在不同的功能页面中,翻页键可以使屏幕在 不同的功能页面间进行切换。
	全屏键	在 A 扫模式下,按全屏键可以切换屏幕的显示方式,可以在 正常模式与放大模式间进行切换。
F	动态记录	按动态记录键,可启动或关闭动态记录功能,仪器将对操作 工程中的探测曲线进行记录。关闭动态记录后,可对此前一 定时间内的探测曲线进行回放。
	峰值记忆	按峰值记忆键,可启动或关闭峰值记忆功能。
	测值显示	按测值显示键,切换测量值在屏幕上的显示方式。
	电源软开关	开关仪器
	组合键1	 在开机程序加载过程中按组合键1可将仪器恢复到出厂设置。 在操作界面中,为了避免当前探伤参数的错误改动,各功
+	上键 + 增益步长	能菜单均可以通过组合键1进行锁定,锁定的菜单也可以通过按组合键1进行解锁。
+	组合键 2 下键 +	 在开机程序加载过程中按组合键2可使仪器在开机画面中进入通讯状态。 在操作界面中,为了避免错误删除已经被存储的探伤曲线记录,可以通过组合键2将该记录锁定,锁定的记录也可以通过按组合键2进行解锁。 在操作界面中,为了避免错误需差当前通道的沿置,可以
<u>/</u> **	冻结键	3. 在採TF-7F回干, 內丁 歷光相以復 二 1 即 通 但 的 反 直, 可以 通过组合键 2 将通道锁定,锁定的通道也可以通过按组合键 2 进行解锁。

BSM360的功能实现分为十五个菜单式功能组、若干个特殊功能。

十五个菜单式功能组分布在三个功能页内,包括基本(BASE)、收发(P/R)、闸门(GATE)、 通道(CHAN)、斜探头(AGLEY)、增益(GAIN)、DAC1、DAC2、AVG1、AVG2、B 扫描(BSCAN)、屏保(SCR)、存储(MEM)、设置(CFG)、高级(ADV),各功能 组的功能介绍见下表。

页	功能组	功能	描述
1	基本	探测范围、材料声速、脉冲移位、探头零点	显示所需的基本参
			数的调节项
1	收发	探头方式、回波抑制	发射和接收所需调
			节项
1	闸门	闸门逻辑/闸门报警、A/B闸门起始、A/B闸门宽度、A/B	闸门设置相关项
		闸门高度	
1	通道	探伤通道、设置保存、设置调出、设置删除	探伤通道相关项
1	斜探头	折射角度/探头K值、工件厚度、探头前沿/标度方式、	斜探头相关设置
		材料声速	
2	增益	补偿增益、添加增益、扫描增益、自动增益	增益相关设置
2	DAC1	DAC 曲线/标定修正、DAC 标定点/修正点、A 闸门起始/A	DAC 曲线标定
		闸门宽度、当量标准	
2	DAC2	DAC 评定线、DAC 定量线、DAC 判废线、增益校正	DAC 曲线设置
2	AVG1	AVG 模式/楔子声速、探头名称、探头频率/晶片尺寸、	AVG 曲线标定
		参考类型/参考尺寸	
2	AVG2	A 闸门起始/AVG 曲线、标定参考、传输校正/衰减校正	AVG 曲线设置
3	B 扫描	B 扫模式/A 扫模式、扫描方向/扫描模式、回放帧数/回	B 扫描相关设置
		放速度、动态回放	
3	屏保	屏幕保护/屏保延时、滚动方向、屏保文字、屏保预览	屏保相关设置
3	存储	组号、调出、保存、删除	数据存储设置
3	设置	探测方式/串口设置、坐标栅格/ELD亮度、填充模式/	相关状态的设置
		按键伴音、语言选择/测量单位	
3	高级	日期/时间、A 闸门起始/A 闸门宽度、直探头校准、斜	高级选项设置
		探头校准	

标志	名称	含义
*	屏幕冻结标志	表明当前屏幕处于冻结状态。
ļ	通讯标志	表明当前仪器正与打印机或 PC 机进行通讯。
1	声程值标志	入射点到反射点的声程距离值。
÷	深度值标志	入射点到反射点的深度值。
~	水平距离值标	入射点到反射点投影到表面的距离值
7	志	
К	回波幅值标志	闸门内最大幅度回波的高度值。

九	边沿采样标志	表明仪器处于"边沿深度"测量模式,也就是厚度和声程是对闸门内
		第一个幅度高于闸门的缺陷回波的测量值。
÷4	峰值采样标志	表明仪器处于"峰值深度"测量模式,也就是厚度和声程是对闸门内
		具有最大幅度信号的缺陷回波的测量值。
Р	峰值记忆标志	表明当前开启了曲线包络,即峰值记忆功能。
Т	动态记录标志	表明当前开启了动态记录功能。
E	操作错误标志	上次键盘操作错误。

三.开机

- a) 按一下开关键①,开机;
- b) 程序加载及开机自检,开机时正常情况下,自动进入上次关机时的状态。仪器参数 与上次关机时一致,但上次关机时的波形不显示。
- c) 检查电池电压,电池电量检测图标如图 2.3 所示若显示电量不足,则在报警铃响过 1 分钟后自动关机;

四. 校准

(一)校准方法一(传统方法):用 CSK-1A 试块校准斜探头

1. 探头前沿校准

- (1) 如图 1 所示,将探头放在 CSK-1B 标准试块的 0 位上
- (2)前后移动探头,使试块 R100 圆弧面的回波幅度最高,回波幅度不要超出屏幕,否则 需要减小增益。
- (3)当回波幅度达到最高时,保持探头不动,在与试块"0"刻度对应的探头侧面作好标记, 这点就是波束的入射点
- (4) 前沿距离校准:

从探头刻度尺上直接读出试块"0"刻度所对应的刻度值,即为探头的前沿值。(或用刻度尺测量图1所示L值,前沿 x=100-L。)



(图1) CSK-I 试块校测零点和前沿示意图

2. 探头 K 值校准(折射角的校准)

由于被测物的材质和楔块的磨损会使探头的实际 K 值与标称值有一些误差。因此需要测 定探头的实际 K 值。校准步骤如下:

(1) 如图 2 将探头放在 CSK-1A 标准试块的适当的角度标记上。

(2)前后移动探头,找到试块边上大圆孔的回波波峰时,保持探头不动。

(3)在试块上读出入射点与试块上对齐的 K 值,这个角度为探头的实际 K 值,将此值输入 BSM360。(或者通过计算斜率校准,见下图 2)



(图 2: 折射角的校准)

3. 材料声速的校准

(1) 先初步设定一大概的声速值;

(2) 调节闸门逻辑为双闸门方式;

(3) 将探头耦合到一与被测材料相同且厚度已知的试块上;

(4)移动闸门A的起点到一次回波并与之相交,调节闸门A的高度低于一次回波最高幅值 至适当位置,闸门A不能与二次回波相交;

(5)移动闸门 B 的起点到二次回波并与之相交,调节闸门 B 的高度低于二次回波最高幅值 至适当位置,闸门 B 不能与一次回波相交;

(6) 然后调节声速,使得状态行显示的声程与试块实际厚度相同;

4. 探头零点的校准

按图1的方法放置探头,用闸门套住最高波,调整探头零点直到声程S=100



(二)校准方法二:用 CSK-IIIA 自动校准斜探头

为了方便操作者校准斜探头角度、前沿、零点及材料声速,仪器提供了斜探头自动校准功能,利用此功能可方便的完成斜探头的校准工作。斜探头校准功能位于高级功能菜单中。

以 BSM360 标配的斜探头为例,它是一个频率 5MHz,晶片为 10mm×10mm,角度为 K2 的单晶探头。可以利用 CSK-IIIA 试块对其进行校准。



图 3.1 CSK-IIIA 试块

假设以深度为 20mm 和 40mm 的两个孔对该探头进行校准,其步骤如下:

- 首先必须将探头零点值设置为 0.00us, 探头前沿设置为 0mm;
- 先初步设定一个大概的声速值如 3230m/s, 探头 K 值设置为 2 (或者探头角度设置 为 63.4°);
- 调节闸门逻辑为单闸门方式,即闸门逻辑为正或负;
- 调节探测范围使得屏幕显示区域能显示 100mm 以上的回波, 如 150mm;

- 将探头耦合到试块上找到 20mm 深度孔的回波,移动探头使得回波幅值最大,移动闸门A的起点到回波并与之相交;
- 选择高级功能组中的斜探头校准功能菜单,按<确认键>确认深度值,同时探头校 准菜单内出现一个深度值数字,调整该数字使之与试块上的反射体实际深度相同, 即 20mm;
- 测量反射体在水平表面投影到探头前端的距离,本例中测量结果约为29mm,再按
 <确认键>确认水平投影值,此时探头校准菜单内出现一个数字(水平投影值), 调整该数字使之与上述测量的数值相同;(注意此时不要按确认键)
- 移动探头找到 40mm 深度孔的回波,并使得回波幅值最大,移动闸门 A 的起点到
 回波并与之相交;
- 选择高级功能组中的斜探头校准功能菜单,按<确认键>确认深度值,此时系统自动调整增益值,使一次回波的幅度大约在屏幕高度的 80%的位置上,同时探头校准菜单内出现一个数字,调整该数字使之与试块上的反射体实际深度相同,即40mm;
- 测量反射体在水平表面投影到探头前端的距离,本例中测量结果约为69mm,再按
 <确认键>确认水平投影值,此时探头校准菜单内出现一个数字,调整该数字使之与上述测量的数值相同;
- 再按<确认键>完成自动校准,此时仪器的角度、前沿、材料声速和探头零点将被 自动调整为准确数值;
- 在校准确认之前,按<冻结>键可以取消校准过程。

五. 制作 DAC 曲线

- 1. 选择 DAC1 菜单, 打开 DAC;
- 2. 制作 DAC 曲线:

使用 CSK-3A 标准试块,移动闸门,分别采集深度为 10、20、30、40(mm)的 4 个点,在 DAC1 菜单上使"DAC 标定点"从 1 增加到 4,即制作好了 DAC 曲线; (注: 当添加两个标定点后,将会在仪器屏幕上自动绘制 DAC 曲线。)

3. 输入探伤标准:

选择 DAC2 主菜单,可以输入探伤标准,比如:将 DAC 偏置 I (判费线偏移量)设置为+5dB,DAC 回波(定量线偏移量) 设置为-3dB,DAC 偏置 II (评定线偏移量) 设置为-9dB。

- 4. 输入增益补偿: 根据相应的探伤标准,一般增益补偿为 2~4dB.
- 六. 焊缝探伤应用

校准,制作 DAC 曲线后,

- 1. 标尺选择: 一般选择水平(投影)做标尺
- 2. 探测范围调节: 考虑到焊缝探伤时要用二次波扫差,所以探测范围调为 S>2P/K
- 3. 输入 DAC 探测标准
- 4. 输入工件的实际厚度
- 5. 探伤灵敏度:调节评定线 40mm 处,达到屏高的 20%
- 6. 探伤:

探伤时一般是使探头垂直焊口走向并沿焊口走向做锯齿型扫查

7. 确定探头沿焊口走向(前后)移动的距离 S (如:图4)
 计算方法:起点(位置2):0



(图4)

(图5)

ŹΡ

9.测定缺陷高于定量线的 dB 值 SL

选择 DAC2 主菜单,选择当量标准子菜单,将当量标准调为定量,按建建,让屏幕右上角显示为当量 SL,用闸门套住伤波,当量 SL 则会自动显示。

10.填表:

序	S1	S2	长度L	缺陷距焊缝中心距离		缺陷距焊缝表	S 3	高于定量线	波高
号				q (mm)		面深度 H(mm)		dB 值(Amax)	区域
				A(+)	B (-)				
1									
2									
3									

11. 存储探伤波形和数据

将探伤波形和数据存储到相应组号。